

反射率测量仪 | SGRM-200N



可实现微小区域和曲面的反射率测量。

可直接测量未经处理的透明薄板的反射率,并能几乎不受底面反射的影响;可快速高精度测量曲面和平面的反射率。

应用系统

光学元件·
薄膜产品

镜架

底座

手动平台

驱动装置

自动平台

光源

目录

显微镜

光通讯

干涉仪

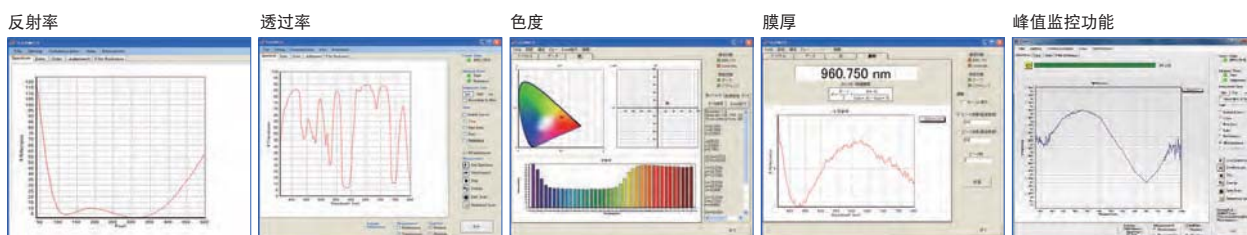
检查 / 观察

生物光学

激光加工

- 采用了特殊结构的半透镜,能高效地收集被测试样的反射光,并高效地导入分光光度计,可快速地完成低反射率样品的测量。
- 采用了特殊的光学结构,有效地避免了底面反射的影响,可直接测量未经处理的透明薄板的反射率。
(使用20倍物镜时,可测最小透明薄板厚度可达0.3mm)
- 采用了特殊卤素灯和独创的光学设计,其有效光量大,获取数据快,重复精度高。
- 测量点小(典型值为 $\phi 50\mu\text{m}$),可直接测曲面,以及膜层的分布特性。
- 结构紧凑,体积小,不占空间。
- 可用Microsoft® Excel® 文件格式保存测量数据。
- 可在同一窗口内,同时显示多个样品的测量结果(曲线),方便数据的对比分析。
- 采用峰值跟踪技术,提高了反射率的重复测量精度



测试结果显示例



技术指标

型号	SGRM-200N
测定波长范围	380~1050nm
样品侧NA	0.22(使用10倍物镜时) 0.44(使用20倍物镜时)
测量光斑尺寸	约 $\phi 25\mu\text{m}$ (使用10倍物镜时)
样品的曲率半径	-2mm~ $-\infty$, +2mm~ ∞
再现性精度	$\pm 0.2\%$ (380~450nm) $\pm 0.02\%$ (451~950nm) $\pm 0.2\%$ (951~1050nm)
显示分辨率	1nm
测量时间	数秒(受选定的采样时间影响)
外形尺寸(本体)	270(W) \times 465(D) \times 615(H)mm(不含突出部)
工作温度范围	18~28 $^{\circ}\text{C}$
工作湿度范围	60%以下(无结露现象)

物镜 (标准配置)		物镜 (可选项)
<p>10倍物镜 UPLFLN10x</p>  <p>测点尺寸: $\phi 50 \mu\text{m}$ 最小可测透明薄板 厚度: 0.4mm</p>	<p>20倍物镜 UPLFLN20x</p>  <p>测点尺寸: $\phi 25 \mu\text{m}$ 最小可测透明薄板 厚度: 0.3mm</p>	<p>1.25倍物镜 PLAPON1.25x</p>  <p>测点尺寸: $\phi 400 \mu\text{m}$</p>

标准白板	波长校正板
<p>WS-3 (可选项) ※测量颜色用基准板</p> 	<p>V-30 (可选项) ※校正波长时使用 (附有校准数据)</p> 

物	物
<p>NY-CZ (可选项) ($\times 0.35 \sim \times 0.7$)</p> 	<p>STC-MCA5MUSB3 (可选项)</p> 



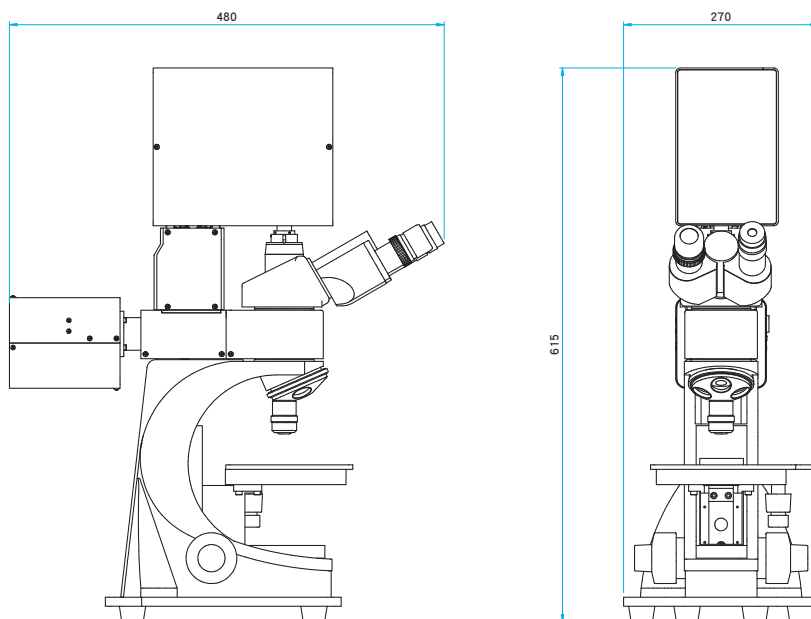
反射率测量软件: SGRMCS (标准附属品)

- 实现了薄样品的高精度测量 (软件+硬件)
- 可同时显示多个样品的测量结果 (最多64个)
- 可用Microsoft® Excel® 文件格式保存测量数据
- 内装合格/不合格判定软件 (判断基准最小可设定1nm波长间隔)
- 增加了测量膜厚功能
- 采用峰值跟踪技术便于调焦

备品 (标准附属品)		
<p>卤素灯 (5个1套) PCL919SMR02VN</p> 	<p>低反射率基准板 球面平凹透镜 SLB-50-70N</p> 	<p>高反射率基准板 铝膜反射镜 TFA-50C08-1</p> 

外形图

(单位: mm)



自重: 13kg (不含电缆)

应用系统

光学元件·
薄膜产品

镜架

底座

手动平台

驱动装置

自动平台

光源

目录

显微镜

光通讯

干涉仪

检查 / 观察

生物光学

激光加工